	Приложение к приказу проректора
	по учебно-методической работе
OT	

Санкт-Петербургский государственный университет

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Монокристальный рентгеноструктурный анализ с использованием программного комплекса SHELX

Single-Crystal X-Ray Structure Analysis using SHELX Program Package

Язык(и) обучения

Трудоемкость в зачетных единицах: 2

Регистрационный номер рабочей программы: 042117

Санкт-Петербург 2014

Раздел 1. Характеристики учебных занятий

1.1. Цели и задачи учебных занятий

Повышение квалификации в области в области рентгенодифракционных методов анализа монокристаллических веществ (рентегноструктурный анализ) и выработке практических навыков рентгеноструктурного анализа веществ с использованием программного комплекса SHELX, применяя полученные навыки для исследования природных и синтетических соединений для работников исследовательских и производственных лабораторий.

1.2. Требования подготовленности обучающегося к освоению содержания учебных занятий (пререквизиты)

Специалисты, имеющие высшее образование в области кристаллохимии, технологии создания кристаллических материалов, базовые знания по курсам «Кристаллография», «Кристаллохимия».

1.3. Перечень результатов обучения (learning outcomes)

Курс дает представление об основах теории рентгеноструктурного анализа монокристаллов, а также о возможностях экспериментальной работы с современными монокристальными дифрактометрами, умение грамотной интерпретации полученных данных с использованием современных программных комплексов, опыт решения конкретных задач рентгеноструктурного анализа соединений разной природы (органические, металлорганические, неорганические соединения).

1.4. Перечень и объём активных и интерактивных форм учебных занятий

18 часов практических занятий

Раздел 2. Организация, структура и содержание учебных занятий

2.1. Организация учебных занятий

2.1.1 Основной курс

	Труд	цоёмі	кость	, объ	ёмы у	лчебн	ой р	абот	ыин	апол	няем	ость	груі	іп обу	/чаюц	цих	ся		
ины,	Контактная работа обучающихся с преподавателем Самостоятельная работа																		
Код модуля в составе дисциплины, практики и т.п.	лекции	семинары	консультации	практические занятия	лабораторные работы	контрольные работы	коллоквиумы	текущий контроль	промежуточная аттестация	итоговая аттестация	под руководством преподавателя	в присутствии преподавателя	сам. раб. с использованием	методических материалов текущий контроль (сам.pa6.)	промежуточная аттестация (сам.раб.)	итоговая аттестация	(сам.раб.)	форм учебных занятий	Трудоёмкость
						ОСН	OBH	RAI	TPA	ЕКТО	РИЯ	[
					с отј	рывом	и от	рабо	ты ф	орма	обуч	ения	[
Период обучения по модулю 01	18			18									36					18	2
	1-10			1-10									1-1						
ИТОГО	18			18									36						2

Виды,	формы и сроки	текущего контроля	успеваемости и	промежуто	очной аттестаци	ии	
Код модуля в составе	•	ущего контроля ваемости	Виды промез аттеста	•	Виды итоговой аттестации (только для программ итоговой аттестации и дополнительных образовательных программ)		
дисциплины, практики и т.п.	Формы	Сроки	Виды	Сроки	Виды	Сроки	
		ОСНОВНАЯ	ТРАЕКТОРИ	RI			
	c	отрывом от рабо	ты форма об	учения			
Период обучения по модулю 01					защита выпускной работы, устно, традиционн ая форма	по графику итоговой аттестации	

2.2. Структура и содержание учебных занятий

<u>№</u> п/п	Наименование темы (раздела, части)	Вид учебных занятий	Количество часов
1	Введение. Кристаллография как наука о кристаллическом веществе. История, характеристика и применение метода рентгеновской дифракции на кристаллических образцах. Современные направления в изучении кристаллических структур.	лекции	2
2	Симметрия кристаллов. Элементы симметрии конечных фигур. Точечные группы симметрии. Трансляционные решетки Браве. Симметрия кристаллических структур. Кристаллографические системы координат. Параметры элементарной ячейки. Понятие о пространственных (Федоровских) группах симметрии. Природа рентгеновских лучей. Условия, необходимые для получения рентгеновских лучей. Дифракция рентгеновских лучей на кристаллах. Условие Лауэ. Уравнение Брэгга-Вульфа. Погасания рефлексов. Закон Фриделя. Дифракционные (лауэвские) классы симметрии.	лекции	2
3	Символы рентгеновского отражения (символы интерференции <i>hkl</i>). Обратная решетка. Сфера отражения (сфера Эвальда). Рассеяние рентгеновских лучей электроном. Поляризационный фактор. Атомный фактор. Рассеяние идеальным кристаллом и понятие структурного фактора. Структурный фактор как комплексная величина.	лекции	2
4	Рассеяние рентгеновских лучей реальным кристаллом. Параметры атомных смещений и предел дифракции. Изотропный и анизотропные параметры атомных смещений. Поглощение рентгеновских лучей веществом и его учет в дифракционном эксперименте. Экстинкция. Интерференционный фактор и влияние размеров кристалла на ширину дифракционного максимума. Фактор шкалы и график Вильсона. Тест на центросимметричность. Исходные данные рентгеноструктурного анализа. Основные этапы рентгеноструктурного анализа и критерии истинности. Работа со структурными базами данных ICSD, CCDC.	лекции	2
5	Знакомство с программным комплексом SHELX. Структура, основы работы, входные и выходные данные. Структура файла INS, основные инструкции SHELX: данные о структуре, данные об интенсивностях, список	лекции	2

	атомов и его параметры, длины и углы связей, параметры процесса уточнения, параметры выдачи данных. Структура файла LST. Примеры.	практические занятия	4
6	Расшифровка и уточнение кристаллических структур в SHELX.	лекции	2
	Примеры расшифровки структуры. Уточнение кристаллических структур. Файлы кристаллографической информации - понятие, структура и формирование СІГ файла. Примеры. Проверка структурных данных на кристаллохимическую достоверность.	практические занятия	4
7	Рентгеноструктурный эксперимент: отбор образцов, подготовка оборудования и условий эксперимента.	лекции	2
	подготовка оборудования и условий эксперимента. Съемка образцов на современных монокристальных дифрактометрах. Обработка полученных экспериментальных данных. Формирование конечных файлов экспериментов: ins, hkl. Работа с программным обеспечением.	практические занятия	4
8	Особенности уточнения кристаллических структур в программном комплексе SHELX. Уточнение структур неорганических, органических и металлорганических	лекции	2
	соединений с тяжелыми и легкими атомами. Практические вопросы. Определение координат и степени заселённостей позиций, тепловых факторов, межатомных расстояний. Работа с файлами ins, res, lst.	практические занятия	4
9	Особенности работы в программных оболочках Wingx и Olex2. Визуализация структурных данных: программы Atoms, Mercury и Diamond. Альтернативные программные	лекции	2
	комплексы для расшифровки структурных данных.	практические занятия	2

Раздел 3. Обеспечение учебных занятий

3.1. Методическое обеспечение

3.1.1 Методические указания по освоению дисциплины

Слушателям будут предоставлены методические разработки по основам работы на автоматических монокристальных дифрактометрах фирмы «Bruker» и список рекомендуемой литературы для освоения теоретических вопросов программы.

3.1.2 Методическое обеспечение самостоятельной работы

Слушателям будут предоставлены методические разработки по основам работы на автоматических монокристальных дифрактометрах фирмы «Bruker» и список рекомендуемой литературы для освоения теоретических вопросов программы.

3.1.3 Методика проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации и критерии оценивания

Зачет по теоретической части, отчеты по практическим работам, отчет по итоговой квалификационной работе.

Критерии оцнивагия

Положительным результатом считается получение количественных характеристик, согласующихся с контрольными в пределах заданной погрешности:

- контрольные задачи с использованием программного комплекса SHELX:
- расшифровка кристаллической структуры

активных методов обучения?

- уточнение кристаллической структуры
- -описание кристаллической структуры

3.1.4 Методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (контрольно-измерительные материалы, оценочные средства)

Не предусмотрено

3.1.5 Методические материалы для оценки обучающимися содержания и качества учебного процесса

Примерная анкета-отзыв по преподаванию дисциплины

Просим Вас заполнить анонимную анкету-отзыв по пройденному Вами курсу. Обобщенные данные анкет будут использованы для совершенствования преподавания. По каждому вопросу проставьте соответствующие оценки по шкале от 1 до 10 баллов (обведите выбранный Вами балл). В случае необходимости впишите свои комментарии.

1.	Насколько Вы удовлетворены содержанием дисциплины в целом?												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Ко	омме	нта	рий_									
2.		Насн	колы	ко Вь	а удс	влеп	воре	ены q	ьорл	лами преподавания?			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Ко	омме	нта	рий_									
<i>3</i> .		Как	Вы	оцен	иває	ете	каче	ство	noc	дготовки предложенных учебно-методическ	их		
		мат	ериа	лов?									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Ко	эмме	нта	рий_									
4.		Насн	колы	ко Ве	ы удс	овлеп	пвор	ены 1	испо.	льзованием преподавателями интерактивных	г и		

Комментарий_____

- 5. Какие из тем дисциплины Вы считаете наиболее полезными, ценными с точки зрения дальнейшего обучения и/или применения в последующей практической деятельности?
- 6. Что бы Вы предложили изменить в методическом и содержательном плане для совершенствования преподавания данной дисциплины?

СПАСИБО!

3.2. Кадровое обеспечение

3.2.1 Образование и (или) квалификация штатных преподавателей и иных лиц, допущенных к проведению учебных занятий

Для чтения лекций - доктор геолого-минералогических наук — профессор, или ведущий специалист РЦ РДМИ, с опытом практической работы в области в области кристаллохимии и рентгеноструктурного анализа.

3.2.2 Обеспечение учебно-вспомогательным и (или) иным персоналом

Для проведения практических занятий – специалисты РЦ РДМИ с опытом практической работы в области порошковой дифрактометрии.

3.3. Материально-техническое обеспечение

3.3.1 Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий

Лекции проводятся в аудиториях, приспособленных для демонстрации мультимедийных презентаций. Часть практических занятий проводится в компьютерном классе, где установлены специальные программы, необходимые для изучения курса

3.3.2 Характеристики аудиторного оборудования, в том числе неспециализированного компьютерного оборудования и программного обеспечения обшего пользования

Для мультимедийных презентаций необходим компьютер, оснащенный программой Microsoft Office PowerPoint и полнофункциональной антивирусной программой, мультимедийный проектор и экран.

3.3.3 Характеристики специализированного оборудования

Монокристальные дифрактометры, Agilent Technologies Excalibur Eos, Agilent Technologies Supernova Atlas, Bruker Smart Apex II, Bruker Kappa Apex II Duo, Rigaku R-Axis Rapid II.

3.3.4 Характеристики специализированного программного обеспечения

Программный комплекс Shelx. Программы Platon, Wingx, Olex2 - для работы со структурными данными; Atoms, Mercury и Diamond - для визуализации; доступ к базам данных ICSD, CCDC на одном ПК.

3.3.5 Перечень и объёмы требуемых расходных материалов

Крио-петелька «HR4-955» - из расчета 2 шт. на 1 слушателя.

3.4. Информационное обеспечение

3.4.1 Список обязательной литературы

Не предусмотрено

3.4.2 Список дополнительной литературы

- 1. Пущаровский Д.Ю. Рентгенография минералов. ЗАО "Геоинформмарк" Москва, 2000.-288 с.
- 2. Порай-Кошиц М.А. Основы структурного анализа неорганических соединений. М.: Изд-во МГУ, 1982.
- 3. Бокий Г.Б. Кристаллохимия. М.: Наука, 1971.
- 4. Jacovazzo C. Fundamentals of Crystallography. 1st, 2nd, 3rd editions. Oxford University Press, 1992, 2002, 2011.
- 5. Урусов В.С., Еремин Н.Н. Кристаллохимия. Краткий курс. М.: Изд. МГУ, 2010
- 6. Кривовичев С.В. Практические вопросы РСА. 2. Расшифровка и уточнение кристаллических структур в комплексе SHELX. СПб. 2007.

3.4.3 Перечень иных информационных источников

- справочные материалы на сайте международного союза кристаллографов www.iucr.org;
- минералогическая база данных www.mindat.org;
- описание возможных исследований на сайте PЦ «Рентгенодифракционные методы исследования» http://xrd.spbu.ru/research/ .

Раздел 4. Разработчики программы

Золотарев Андрей Анатольевич, к.г.-м.н., доцент кафедры кристаллографии СПбГУ, ведущий специалист РЦ РДМИ

Гуржий Владислав Владимирович, к.г.-м.н., доцент кафедры кристаллографии СПбГУ, заместитель директора РЦ РДМИ СПбГУ